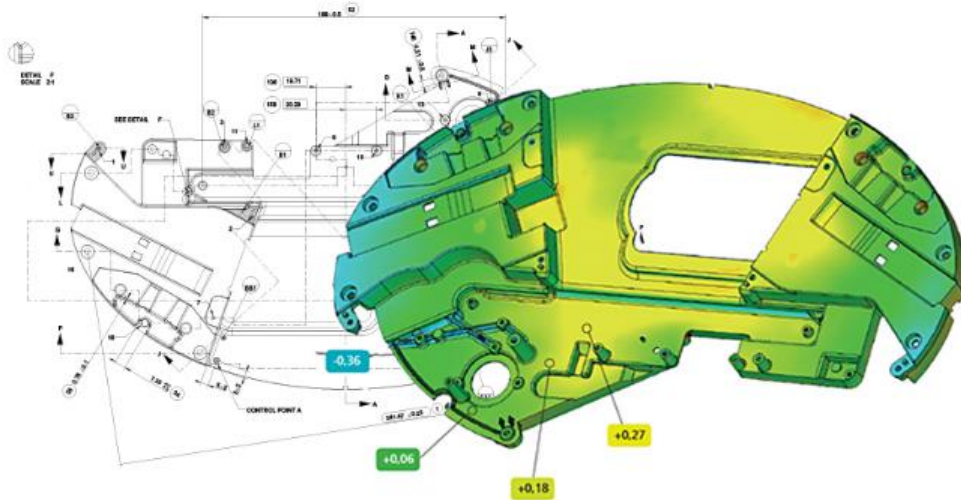


幾何公差尺寸檢測暨應用研討會



全世界在產品設計的改變與提升，無論是汽車、航太或是電子產業，在檢測的品質與效率要求也隨之提高，漸漸地走向幾何公差尺寸的規範，相較於傳統的尺寸標註已經無法滿足設計要求。

在全球化的業務要求下，也有越來越多的幾何公差尺寸應用產生，GD&T 標註占比也更多、更複雜。此次研討會將會分享幾何公差應用於產品設計，量測困難點與實際應用案例。此次活動內容，不只針對品質檢測，從產品設計，開發端應用，再到品質管制，透過以完整的產品開發流程來分享 GD&T 於不同開發階段的技術應用。同時也邀請使用客戶前來分享相關經歷，無論是產品設計或是品管人員均適合參加。



研討會主題：

- 現今 GD&T 三維量測趨勢
- PMI 應用於產品整合設計
- 智能化全自動 3D 掃描與檢測
- 產品開發問題解析應用
- 聯盟中心應用案例分享

時間：

7/18(三)13:30~16:00

地點：

南台灣創新園區
台南市安南區工業二路 31 號

本次研討會免費參加，如有報名相關事項請洽
聯絡人：國立高雄第一科技大學 張弘瑞 02-6011000 轉 2233 ; ame@nkfust.edu.tw